

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

Сборник трудов
III международной научной конференции

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ
КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ,
НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ**

15-16 мая 2014 г.



Алматы 2014

Физико-технический факультет

Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики
Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа

При поддержке
научных школ
научных центров
научных институтов
и научных организаций

Сборник трудов
III международной научной конференции

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ
КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ,
НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ

15-16 мая 2014 года

Алматы

Шарсек Сарсембеков родился в 1938 году в селе Талда-Курган. Начальную школу окончил с золотой медалью в селе, которое носило имя Н.К. Крупской. По окончании средней общеобразовательной школы с золотой медалью в селе, которое носило имя Петра Назаровича Шмидта, поступил на физико-математический факультет Алматинского университета им. А.Н. Тихомирова. После демобилизации из Военно-Морской службы он вернулся в университет и окончил его в 1962 году по первому набору на кафедру физики известным физиком академиком Монсеем Ибраимовым.

Свою дипломную работу Ш.Сарсембеков защитил по теме «Физика твердого тела Института ядерной физики под руководством профессора А.Н.Тихомирова и старшего научного сотрудника М.М. Семинского. Она была посвящена изучению явления аномального эффекта атомально-выбиваемого фотонизрахения в трехах германия».

На окончании университета (ИТФ) он был рекомендован кандидатом наук профессором М.М. Корасупским в НИИ Сарсембеков был назначен в научную группу профессора А.С. Ноффа. Докторантскую работу он выполнил в научной группе профессора Бориса Тимофеевича Куломбая. Профессор Б.Т. Куломбай был учеником мэтрата магистра физики Юрия Ивановича Смирнова, членом научного совета Государственной премии СССР по физике. В 1968 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Физика явлений перехода из кристаллического в стеклообразное состояние в полупроводниках С₈₀S₂₀ и Al₂O₃», построив электропроводность в кристаллах стеклообразных полупроводников. Защита диссертации состоялась в апреле 1973 года. В апреле того же года он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Физика полупроводникового кристалла С₈₀S₂₀ в области температур 100-1000°К» в Институте физики Академии наук РК. По результатам кандидатской диссертации в 1983 году профессором М.М. Корасупским в НИИ Сарсембеков назначили защищать кандидатскую диссертацию в институтском совете Технологического инженерного университета им. М.Ахметова в 1992 году. Кандидатская диссертация по теме «Физика полупроводникового кристалла С₈₀S₂₀ в области температур 100-1000°К» в институте Технологического университета им. М.Ахметова в 1992 году. В 1993 году он сменил кафедру физики на кафедру физики полупроводникового кристалла С₈₀S₂₀ в институте Технологического университета им. М.Ахметова в Карагандине. Под руководством профессора И.М. Абдрахманова и М.М. Корасупского в 1998 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Физика полупроводникового кристалла С₈₀S₂₀ в области температур 100-1000°К» в институте Технологического университета им. М.Ахметова в Карагандине.

Алматы
«Қазақ университеті»
2014

Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики
Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа
АНО Сарсембеков Ш.Ш. основал новое научное направление в физике гидроакустики и гидроакустической оптики

<i>I.Kh. Zharekeshev</i>	
Sustainable renewable energy capacity in kazakhstan: photovoltaics towards the EXPO-2017 exhibition.....	69
<i>B.Ya. Yavidov, S.M. Zholdassova and S.K. Tulepbergenov</i>	
Combined influence of lattice's strain and electron-phonon interaction's screening on small polaron	70
<i>Г. Партизан, Yao Ma, Б.С. Медянова, Б.З. Мансуров, Б.А. Алиев</i>	
Исследование углеродных наноструктур полученных методом термического cvd на частицах нанопорошков металлов.....	71
<i>Г. Партизан, Yao Ma, А. Қалимоловна, Б.З. Мансуров, Б.А. Алиев</i>	
Исследование морфологии и состава частиц нанопорошков металлов полученных методом ЭВП.....	73
<i>О.Ю. Приходько, Н.К. Манабаев, С.Я. Максимова, С.Л. Михайлова</i>	
Влияния размерного эффекта на оптические свойства пленок алмазоподобного углерода, модифицированных примесью платины	74
<i>О.Ю. Приходько, Н.Ж. Алмасов, С.А. Дюсембаев, Д.Т. Кунайина, А.Н. Базаркулова, К.Н. Турманова</i>	
Модификация электронных свойств аморфных пленок халькогенидных стеклообразных полупроводников.....	75
<i>С.А. Дюсембаев, Ж.К. Толепов, Н.Р. Гусейнов, О.Ю. Приходько, Н.Ж. Алмасов, С.Я. Максимова, А.Е. Базаркулова, Ш.А. Жуматова, Н.Т. Темирбулатова</i>	
Оптические параметры пленок халькогенидных стеклообразных полупроводников систем Ge-Sb-Te, легированных висмутом	75
<i>С.А. Дюсембаев, Ж.К. Толепов, Н.Р. Гусейнов, О.Ю. Приходько, Н.Ж. Алмасов, С.Я. Максимова, А.Е. Базаркулова</i>	
Эффекты переключения в пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников систем Ge-Sb-Te, легированных медью.....	76
<i>О.Ю. Приходько, Н.К. Манабаев, С.Я. Максимова, С.Л. Михайлова, Т.К. Аширов, К. Токбергенов, Д.К. Жанаева</i>	
Структурная модификация электронных свойств пленок аморфного гидрогенизированного углерода	78
<i>Г.Ш. Яр-Мухамедова, К.О. Кошымова</i>	
Нанокомпозициялық қаптамаларының коррозиялық процестерін оптикалық металлография адісімен зерттеу.....	78
<i>Г.Ш.Яр-Мухамедова, Г.А.Исмаилова, А.Мархабаева, К.Кошимова</i>	
Особенности формированияnanoструктурированных композиционных электролитических систем.....	79
<i>М.Б. Шарибаев, А. Жуманазаров, Е. Бижсанов</i>	
Определение структурных дефектов в квантово-размерных структурах методом НТ ФЛ.....	79
<i>М. Шарибаев, Е. Өтөніязов, А. Юлдашев</i>	
Радиационные эффекты в квантово-размерных структурах соединений A ₂ B ₆	81
<i>М.Б. Шарибаев, Қ.А. Исмайлов, Е.Өтөніязов</i>	
Исследование оптические характеристики GaAs и AL _x Ga _{1-x} As, структур легированных иттербием	82
<i>Г.С. Устаева, А. Б. Лесбаев, Б. М. Дағынов, З.А. Мансуров</i>	
Синтез полимерных нановолокон методом импульсного электроспиннинга	84
<i>Ю.Ж. Тулеушев, В.Н. Володин, А.А. Мигунова, Е.А. Жаканбаев</i>	
Магнетронное получение аморфного и микроморфного кремния.....	84
<i>С. Момынов, Е.С. Мухаметкаримов, А.Е. Давлетов, И.Р. Габитов, А.И. Маймистов</i>	
Неколлинеарная генерация второй гармоники в метаматериалах	85
<i>И.Н. Пархоменко, Ф.Ф. Комаров, Л.А. Власукова, О.В. Мильчанин, И.А. Романов, А.К. Тогамбаева, Л.К. Тоганбаева</i>	
Структурные, оптические и электрофизические свойства нитрида кремния, обогащенного кремнием	87
<i>С.Б.Алдабергенова, Ш.Б.Байганатова, Мансуров Б.З., Е.Т.Таурбаев, Т.И.Таурбаев</i>	
Двумерные углеродные дефекты карбida кремния как центры зародышеобразования для ориентированного роста нанокристаллов алмаза	88
<i>Ф. Султанов, М. Ауелханкызы, Г. Смагулова, Б. Лесбаев, З. Мансуров</i>	
Аэрогели на основе оксида графена с добавками углеродных нанотрубок: синтез и свойства	89
<i>Г.К. Ташикеева, Н.А. Салыбаева</i>	
Свойства углеродных пленок состава а-C-H	90

смеси с 5, 10 и 15 об. % H₂. Распыление кремния проведено планарными магнетронами постоянного тока (авторской конструкции) [5]. Рентгеноструктурные исследования выполнены на дифрактометре D8 Advance. Установлено, что покрытия представлены а-Si с микрокристаллитами кубической сингонии, обнаружены признаки существования некубического кремния – рис. 1(1). При увеличении содержания H₂ до 10 об.% и 15 об.% (рис. 1(2)) количество фазы некубического Si в покрытии возрастает. С помощью компьютерного фиттинга установлено, что наиболее точно совокупность рефлексов описывается орторомбической элементарной ячейкой с параметрами: a = 0,83133 нм, b = 0,88066 нм и c = 0,65917 нм. Для исследования возможности управления микрокристаллической структурой а-Si применены рекристаллизационные отжиги. Известно, что для рекристаллизации необходим нагрев до 0,5-0,6 T_{пл}. Для проведения отжигов выбрана температура 0,5 T_{пл} Si = 700°C. На рис. 1 (3) приведены дифрактограммы образца аморфного Si, напыленного с использованием газа, содержащего 15 об.% H₂, после отжига при 700°C в течении 1 часа, свидетельствующие о стабильности этой фазы.

По формуле Дебая-Шеррера был рассчитан размер зерен фазы микроморфного кремния. Для рефлекса с индексами Миллера (111) измерена полная ширина пика на полувысоте FWHM = 0,01669 рад. Рассчитанный средний размер зерен равен 8,6 нм. Отмечено, что размер зерен фазы кубического кремния имеет максимальное значение для покрытия, напыленного в атмосфере с 10 об. % H₂ после отжига 5 часов. Значение среднего размера зерна составило 9,6 нм. Во всех образцах после отжигов при 700°C 1 час и 5 часов наблюдается рефлекс с d_{hkl} = 0,26732 нм, который можно отнести к нестехиометрической фазе гидрида кремния Si_{4-x}H.

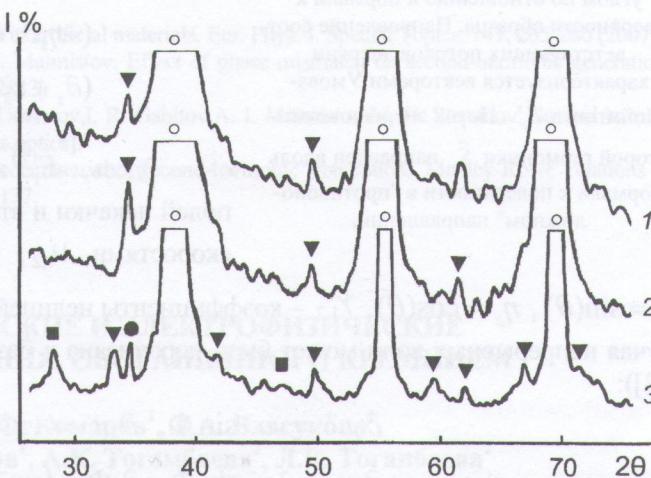


Рис.1. Дифрактограммы образцов Si-покрытий, сформированных при концентрации H₂, об.-%: 1-5; 2,3-15; 3-после отжига при 700°C; ▼ – Si некубической сингонии; ■ – кубический Si; ● – нестехиометрический гидрид Si_{4-x}H; ○ – Ta (подложка)

1. Von Schnering H.-G. et al. The lithium sodium silicide Li₃NaSi₆ and the formation of allo-silicon // J. Less Comm. Metals, 1988. – V.137, № 1-2. – P.297-310.
 2. Bystritsky V.M. et al. Measurement of astrophysical S-factors and electron screening potentials for d(d,n)³He reaction in ZrD₂, TiD₂ and TaD_{0.5} targets in the ultralow energy region using plasma accelerator // Nuclear Physics A, 2012. – V. 889 – P. 93-104.
 3. Volodin V.N., Tuleushev Yu.Zh., Zhakanbaev E.A. Radiation Synthesis of superconducting Phase in Niobium-Tin Film Coating // Abstr. Int. Conf. "Nuclear Science and its Application". – Samarkand, Uzbekistan. 25-28 September 2012. – P. 257.
 4. Володин В.Н., Тулеушев Ю.Ж., Жаканбаев Е.А., Структура и фазовый состав напыленных пленок системы ниобий-углерод // ФММ. – 2013. – Т. 114, № 2. – С. 1-5.
5. Пат. РФ №2218450. Магнетрон / Тулеушев А.Ж., Тулеушев Ю.Ж., Володин В.Н.; опубл.10.12.2003. Бюл.№34.

НЕКОЛЛИНЕАРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В МЕТАМАТЕРИАЛАХ

С. Момынов¹, Е.С. Мухаметкаримов¹, А.Е. Давлетов¹, И.Р. Габитов^{2,3}, А.И. Маймистов⁴

¹КазНУ им. аль-Фараби, физико-технический факультет, Алматы, Казахстан

²Университет Аризоны, Тусон, США

³Институт Теоретической Физики им. Л. Ландау, Черноголовка, Россия

⁴МИФИ, кафедра физики твердого тела и наносистем, Москва, Россия

В работе изучается процесс генерации второй гармоники в метаматериалах с отрицательным показателем преломления. Рассматривается случай, когда фазовый синхронизм достигается в результате неколлинеарного взаимодействия двух падающих под углом друг другу на частоте фундаментальной гармонике плоских волн с волной второй гармоники $\vec{k}_1^+ + \vec{k}_1^- + \vec{k}_2 = 0$, здесь \vec{k}_1^\pm, \vec{k}_2 волновые вектора соответствующие волнам накачки и второй гармоники. Данная задача является обобщением коллинеарной генерации второй гармоники рассмотренный в работах [1-4]. Предполагается, что на фундаментальной частоте ω показатель преломления метаматериала имеет отрицательный знак, а на

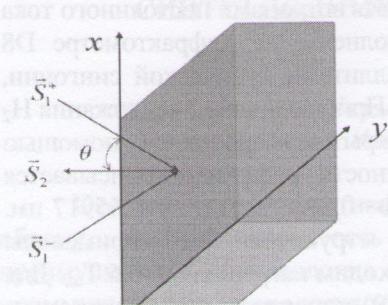


Рис. 1. Две волны накачки падают под углом по отношению к нормали к поверхности образца. Направление соответствующих потоков энергии характеризуется векторами Умова-Пойтинга \vec{S}_1^\pm . Поток энергии волны второй гармоники \vec{S}_2 направлен вдоль нормали к поверхности в "противоположном" направлении.

частоте второй гармоники 2ω является положительным. Волна второй гармоники распространяется вдоль биссектрисы волновых векторов падающих волн накачки. При этом направление вектора Умова-Пойтинга \vec{S}_2 второй гармоники противоположно направлению проекции векторов Умова-Пойтинга \vec{S}_1^\pm накачки на биссектрису (см.рис.1). Система уравнений, описывающая неколлинеарную генерацию второй гармоники, имеет следующий вид [1]:

$$\begin{aligned} (-\eta_z \partial_z + \eta_x \partial_x + v_1^{-1} \partial_t) E_1^{(+)} &= i \gamma_1 E_1^{(-)*} \varepsilon_2 e^{i \overline{\Delta k} \cdot \vec{r}}, \\ (-\eta_z \partial_z - \eta_x \partial_x + v_1^{-1} \partial_t) E_1^{(-)} &= i \gamma_1 E_1^{(+)*} \varepsilon_2 e^{i \overline{\Delta k} \cdot \vec{r}}, \\ (\partial_z + v_2^{-1} \partial_t) E_2 &= i \gamma_2 E_1^{(-)} E_1^{(+)} e^{-i \overline{\Delta k} \cdot \vec{r}}. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь, $E_1^{(\pm)}$ и E_2 комплексные огибающие электрических полей накачки и второй гармоники соответствующими групповыми скоростями $v_{1,2}$, $\overline{\Delta k}$ рассогласование векторного синхронизма,

$\eta_x = \sin(\theta)$, $\eta_z = \cos(\theta)$, $\gamma_{1,2}$ – коэффициенты нелинейного взаимодействия. Система уравнений (1) для случая непрерывных волн может быть переписана в безразмерном виде в терминах амплитуд и фаз (ср. [2,3]):

$$\begin{aligned} \partial_z u^+ &= vu^- \sin \Phi, \quad \partial_z u^- = vu^+ \sin \Phi, \\ \partial_z v &= u^+ u^- \sin \Phi, \quad \partial_z \Phi = \left(vu^-/u^+ + vu^+/u^- + u^+ u^-/v \right) \cos \Phi - \Delta, \\ u^\pm(0) &= u_0^\pm, \quad v(L)=0, \quad \Phi(L)=-\pi/2, \end{aligned} \quad (2)$$

здесь $\Phi = \varphi_2 - \varphi_1^+ - \varphi_1^-$, где φ_1^\pm и φ_2 – фазы полей накачки и второй гармоника. Наличие общего множителя $\sin \Phi$ в уравнениях для полей системы (2) означает, что обмен энергией между гармониками происходит таким образом, что обе фундаментальные волны теряют либо приобретают энергию одновременно. Обмен энергии между волнами u^- и u^+ через вторую гармонику невозможен. Система уравнений (2) имеет три интеграла движения [2-4]:

$$(u^+)^2 - v^2 = m_1^2, \quad (u^-)^2 - v^2 = m_2^2, \quad u^- u^+ v \cos \Phi - v^2 \Delta/2 = 0, \quad (3)$$

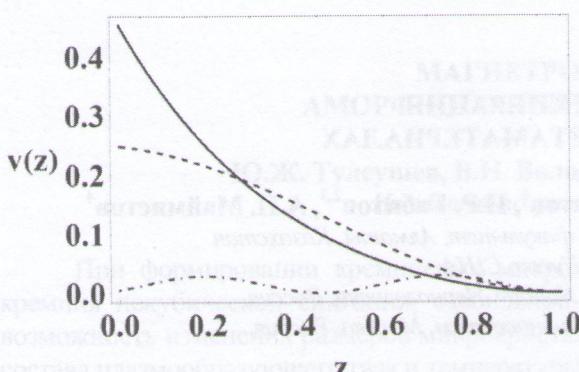


Рис. 2. Пространственные профили интенсивностей второй гармоники внутри образца при различных Δ : $\Delta < \Delta_{cr}$ – сплошная, $\Delta = \Delta_{cr}$ – штриховая и $\Delta > \Delta_{cr}$ – штрих-пунктирная кривая, соответственно.

где $m_{1,2} = u_1^\pm(L)$. Из последнего уравнения системы (3) следует, что $\cos \Phi = v \Delta / \sqrt{[2 \sqrt{(v^2 + m_1^2)(v^2 + m_2^2)}]}$. Максимальное значение этой функции достигается в точке $v_0 = \sqrt{m_1 m_2}$. Принимая во внимание неравенство, $|\cos \Phi| \leq 1$ приходим к выводу, что существует два режима генерации. В первом случае, когда $|\Delta| \leq \Delta_{cr} = 2(m_1 + m_2)$, значение v может неограниченно расти вдоль z . Это означает, что во всем интервале $0 \leq z \leq L$ происходит перенос энергии от фундаментальных гармоник ко второй гармонике. В случае, когда $|\Delta| > \Delta_{cr}$ областью разрешенных значений v является интервал $0 \leq v \leq v_0$, где

$$v_0 = \sqrt{K - \sqrt{K^2 - 64m_1^2 m_2^2}} / 2\sqrt{2}, \quad K = \Delta^2 - 4(m_1^2 + m_2^2). \quad \text{При этом вдоль образца возникает периоди-}$$

ческий обмен энергией между фундаментальными и второй гармоникой, что приводит к пространственным осцилляциям амплитуд взаимодействующих волн. На рисунке 2 представлены зависимости интенсивности второй гармоники от координаты z . Сплошная кривая соответствует идеальной фазовой синхронизации, в этом случае преобразование энергии волн накачки во вторую гармонику имеет место вдоль всего образца. Штриховая кривая соответствует критическому значению рассогласования фазы. Штрих-пунктирная кривая отвечает случаю $\Delta > \Delta_{cr}$, который соответствует наличию взаимного обмена энергией между волнами накачки и волной второй гармоники. Амплитуда второй гармоники является периодической функцией координаты. Таким образом, в отличие от обычного случая эффективное преобразование частоты в метаматериалах имеет место для интервала фазовых расстроек, что является привлекательным с точки зрения физического эксперимента.

1. A.I. Maimistov, I.R. Gabitov, Nonlinear optical effects in artificial materials, Eur. Phys. J. Special Topics. 147, 265-286 (2007)
2. Zh. A. Kudyshev, A. E. Davletov, I. R. Gabitov, A. I. Maimistov, Effect of phase mismatch on second-harmonic generation in negative-index materials, PHYSICAL REVIEW A 87, 063840 (2013)
3. Ye. S. Mukhametkarimov, Zh. A. Kudyshev, A. E. Davletov, I. R. Gabitov, A. I. Maimistov, M. G. Stepanov, Second harmonic generation in dissipative metamaterials, arXiv:1310.3109 [physics.optics].
4. Popov A.K. and Shalaev V.M., Negative-index metamaterials: Second-harmonic generation, Manley-Rowe relations and parametric amplification // Appl. Phys. B 2006 – Vol. 84 P.131– 137.

СТРУКТУРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРИДА КРЕМНИЯ, ОБОГАЩЕННОГО КРЕМНИЕМ

**И.Н. Пархоменко¹, Ф.Ф. Комаров¹, Л.А. Власукова¹,
О.В. Мильчанин¹, И.А. Романов¹, А.К. Тогамбаева², Л.К. Тоганбаева²**

¹Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

²Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Аморфный нитрид кремния широко применяется в микроэлектронике. Материал характеризуется высокой механической и термической прочностью, инертностью к различным агрессивным средам, эффектом памяти и т.д. В последние годы интенсивно изучаются люминесцентные свойства нитрида кремния, с целью создания излучателя света, совместимого с интегральной кремниевой технологией. Несмотря на большое количество работ, посвященных светоизлучающим свойствам нитрида кремния, природа люминесценции нитрида кремния до сих пор не выяснена. Цель нашей работы – исследовать влияние высокотемпературного отжига на структурные оптические и электрофизические свойства нитрида кремния, обогащенного кремнием.

Нитрид кремния осаждался на подложку Si n-типа методом плазменно-стимулированного газофазного осаждения из смеси моносилана (SiH_4) и аммиака (NH_3) при температуре 300 °C. Толщина пленок измерялась методом эллипсометрии. Образцы дополнительно отжигались в атмосфере азота при температурах 900 °C в печи сопротивления в течение часа. Для анализа распределения атомов Si и N по глубине нитридных слоев использовался метод Резерфордовского обратного рассеяния (POP), структура слоев исследовалась методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе Hitachi H-800 с ускоряющим напряжением 200 кэВ в геометрии “plan-view”. Спектры фотolumинесценции (ФЛ) возбуждались при комнатной температуре He-Cd лазером с $\lambda_{возб.}=325$ нм. Дополнительно снимались спектры комбинационного рассеяния света (КРС) на микрорамановском спектрометре Integra Spectra в геометрии обратного рассеяния при $\lambda_{возб.}=473$ нм. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) снимались на установки Semiconductor/component Test System.

Толщина пленки нитрида кремния составляла 99 нм. Стехиометрический параметр x , рассчитанный из спектров POP, равен 1.0, что говорит о наличии сверхстехиометрического избыточного кремния в исходной пленке нитрида кремния. В исходных образцах ФЛ не наблюдается. Отжиг приводит к появлению люминесценции в широкой области от УФ – до ближней ИК-области. На рисунке 1а представлен спектр отожженного образца, разложенный гауссианами. Сложная структура спектра ФЛ связана с различными механизмами излучательной рекомбинации в нитриде кремния. Так полоса в оранжевой области (~ 587 нм) может быть связана со свечением от кремниевых кластеров с размерами около 3 нм [1]. Действительно, по данным ПЭМ исходные образцы имеют однородную аморфную структуру, однако отжиг приводит к формированию кремниевых преципитатов (вставка, рисунок 1а). Полосы в сине-зеленой области, возможно, связаны с формированием нестехиометрических дефектов в нитриде кремния, представляющие собой 3-координированный атом кремния с тремя соседними атомами